**Nazwa przedmiotu:**

Metrologia papiernicza i poligraficzna 1

**Koordynator przedmiotu:**

dr inż. Konrad Blachowski

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Papiernictwo i Poligrafia

**Grupa przedmiotów:**

Technologia papiernictwa i poligrafii

**Kod przedmiotu:**

IP-IDP-MEPA1-3-10Z

**Semestr nominalny:**

3 / rok ak. 2019/2020

**Liczba punktów ECTS:**

3

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 75 . Obejmuje:
1) Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:
Uczestnictwo w wykładach - 30 godz. Konsultacje - 10 godz.
2) Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem (Praca własna studenta) :
Przygotowanie do zajęć - 25 godz. Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

1,5 punktu ECTS.

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

-

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 450h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Przedmioty, na których bazuje dany przedmiot (prerekwizyty):
[IP-IDW-MATE3-5-09Z] Matematyka 3 [IP-IDW-FIZY2-4-09Z] Fizyka 2.

**Limit liczby studentów:**

-

**Cel przedmiotu:**

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami metrologii ogólnej. Dodatkowo w ramach niniejszego przedmiotu słuchacze poznają zagadnienia związane z filozofią pomiaru oraz z oceną niepewności pomiarowej. Ponadto studenci poznają przykładowe właściwości metrologiczne stosowane w przemyśle poligraficznym i papierniczym. Szczególny nacisk kładziony jest na te właściwości, które związane są z oceną jakości produktów przemysłu poligraficznego.

**Treści kształcenia:**

Teoria i filozofia pomiaru; rozwój teorii pomiaru; elementy formalnej teorii pomiaru; empiryczny system relacyjny; liczbowy system relacyjny; definicja pomiaru; warunki reprezentatywności; warunki jednoznaczności przekształceń pomiędzy empirycznym i liczbowym systemem relacyjnym; skale pomiarowe i miary; pomiar ekstensywny; definicja wielkości pomiarowej; wielkości addytywne; skala pomiarowa wielkości addytywnej; skala odpowiedniościowa właściwości; skala uszeregowana właściwości; pomiar pośredni i pośrednie skale pomiarowe; pomiary wielowymiarowe; klasyfikacja skal pomiarowych: nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa; transformacje dopuszczalne; proces pomiarowy na potrzeby badań naukowych; definicja doświadczenia naukowego; uproszczona definicja pomiaru; układy jednostek miar: SI, CGS, MKS, MTS, MkGS, system brytyjski; wtórne jednostki miar (przedrostki); narzędzia pomiarowe; wzorce (etalony) i ich klasyfikacja; przyrządy pomiarowe; parametry przyrządów pomiarowych: rozdzielczość, powtarzalność, odtwarzalność, dokładność; przetworniki pomiarowe; układy pomiarowe; systemy pomiarowe; metody pomiarowe i ich klasyfikacja (metody analogowe i cyfrowe; metody bezpośrednie, pośrednie i złożone, metody porównawcze, odchyłowe, różnicowe, zerowe, podstawieniowe i przedstawieniowe;
Podstawy rachunku błędów; definicja błędu, błędu względnego, wartości poprawki oraz błędu granicznego; klasyfikacja błędów pomiarów (podstawowe i dodatkowe; wzorcowania, odczytu, próbkowania i zliczania; systematyczne i przypadkowe);
Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zastosowaniach metrologicznych; parametry rozkładu zmiennej losowej: przestrzeń mierzalna, prawdopodobieństwo, zmienna losowa, dystrybuanta zmiennej losowej, gęstość prawdopodobieństwa, wartość oczekiwana, wariancja, unormowane i standaryzowane zmienne losowe. Przykłady rozkładów zmiennych losowych używanych w procesach pomiarowych: zero-jedynkowy, dwumianowy (Bernoulliego), Poissona, równomierny (jednostajny), normalny (Moivre’a-Gaussa, Gaussa-Laplace’a), rozkład Studenta, rozkład logarytmiczno-normalny, rozkład Gamma (w tym wykładniczy oraz chi-kwadrat).
Charakterystyka błędów losowych pomiaru: estymatory – średnia arytmetyczna, odchylenie kwadratowe średniej arytmetycznej, odchylenie standardowe; przedziały ufności; opracowywanie wyników pomiarów.
Pojęcia i procedury związane z wyznaczeniem niepewności pomiarowej.

**Metody oceny:**

Ocena na podstawie wyników pisemnego egzaminu

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

1. Sydenham P.H.: Podręcznik metrologii. Tom I: Podstawy teoretyczne. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988
2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 2003
3. Sałaciński T.: Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.

**Witryna www przedmiotu:**

http://ip.hoff.pl/content/blogcategory/73/177/

**Uwagi:**

-

## Charakterystyki przedmiotowe